

LLDPE中天合创聚乙烯EGF-35B

产品名称	LLDPE中天合创聚乙烯EGF-35B
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	货号:002 数量:600 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

LLDPE中天合创聚乙烯EGF-35B

在所得陶瓷层/剥离薄膜复合体的陶瓷层表面，通过丝网印刷法形成金属膜形式的、干燥后的厚度为 3μ 的图案化的M电极印刷层。接着，将所得金属膜/陶瓷层/脱模薄膜复合体切裁为 $300\text{mm}\times 300\text{mm}$ 的大小，得到单片样品。对于所得单片样品，以 $20\text{m}/\text{分钟}$ 的剥离速度从脱模薄膜上剥离金属膜/陶瓷层复合体，测定所述剥离中的剥离静电量。在剥离的金属膜/陶瓷层复合体上的距离陶瓷层的表面 5cm 的位置设置集中电位测定仪(春日电机(株)制造，商品名静电电位测定仪SV-10)，在温度 22°C 、湿度 $44\% \text{RH}$ 的气氛下测定剥离静电量。测定是对100片单片样品进行实施，将它们的平均值作为陶瓷片的剥离静电量(单位kV)。

或者按照下述评价基准实施评价。[陶瓷片剥离静电评价基准]○剥离静电量为 20kV 以下(剥离静电良好)X剥离静电量超过 20kV (剥离静电不良)(8)陶瓷片的剥离评价对于上述(7)中的单片样品，在从脱模薄膜上剥离金属膜/陶瓷层复合体时，按照下述评价基准对所述的剥离状况实施评价。[剥离评价基准] 剥离力适度，金属膜/陶瓷层没有断裂，脱模薄膜上未见陶瓷层的残留(实际应用上完全没有问题的水平)○剥离力稍重，或者是金属膜/陶瓷层上可见一些破裂，或者脱模薄膜上稍微可见陶瓷层的残留(实际应用上完全没有问题的水平)X剥离力过重，或者金属膜/陶瓷层上可见破裂，或者脱模薄膜上可见陶瓷层的残留(实际应用上有问题的水平)(9-1)陶瓷片的积层评价1(实际应用特性代替评价)在由上述(5)(条件1)得到的陶瓷片上积层图案印刷的Ni电极印刷层(干燥后的厚度为 $3\mu\text{m}$)。

使用所得陶瓷片/电极积层体，以一侧的端部为基准积层10层，按照下述评价基准对此时的电极印刷层的位置偏离程度实施位置偏离评价。[位置偏离评价基准] 位置偏离低于 $200\mu\text{m}$ (实际应用上完全没有问题的水平)○位置偏离 $200\mu\text{m}$ 以上但低于 $400\mu\text{m}$ (实际应用上没有问题的水平)X位置偏离 $400\mu\text{m}$ 以上(实际应用上有问题的水平)(9-2)陶瓷片的积层评价2(实际应用特性代替评价)使用通过C 照相机检测位置的方式的叠层机(夕”WH、义)，将按照与上述(7)同样的方法得到的切裁以及剥离后的金属膜/陶瓷层复合体积层10层，得到积层

体。对于所得积层体，以第1层的金属膜/陶瓷层复合体为基准，使用显微镜测定各层的偏离量，将所得值作为位置偏离(单位 μm)。评价是按照下述评价基准实施的。积层是在剥离脱模薄膜后立即实施。[位置偏离评价基准] 位置偏离低于 $200\ \mu\text{m}$ (实际应用上完全没有问题的水平)○位置偏离 $200\ \mu\text{m}$ 以上但低于 $400\ \mu\text{m}$ (实际应用上没有问题的水平)×位置偏离 $400\ \mu\text{m}$ 以上(实际应用上有问题的水平)(10)卷表层的维式硬度(Hv)按照JIS Z2244(1961)的方法，通过以下方法进行测定。测定是在实施例得到的脱模薄膜卷的表层，除去距离端面 5mm 的部分，在宽度方向上测定10点，以大值作为卷表层的维式硬度(Hv)。(11)卷绕偏离对于实施例所得的脱模薄膜卷，按照下述评价基准评价端面的卷绕偏离状况。[卷绕偏离评价基准] 卷绕偏离为 1mm 以下(完全没有问题，可优选使用的水平)○卷绕偏离超过 1mm 但为 2mm 以下(可没有问题地使用的水平) 卷绕偏离超过 2mm 但为 3mm 以下(稍有问题但可以使用的水平)×卷绕偏离超过 3mm (有问题，无法使用的水平)(12)平坦性由脱模薄膜卷中取长度 2m 的薄膜样品，将卷绕在卷上时为卷的表面的一侧朝上，在平坦的台面上水平铺开。静置10分钟后观察薄膜样品的整个表面，测量残留在该表面上的皱纹(凹槽，薄膜从上述台面上翘起的部分)的长度(单位 cm)，将其合计除以测定面积(单位 m^2)，计算平坦度(单位 cm/m^2)。

由所得数据记录分别读取纵向、横向的大厚度(单位 μm)和小厚度(单位 ym)，结合上述薄膜厚度，由下述式求出厚度偏差(单位%)。厚度偏差(%)= $(\text{大厚度}-\text{小厚度})/\text{薄膜厚度}\times 100$ (14)陶瓷片的厚度偏差对于由上述(5)(条件2)所得的陶瓷层/脱模薄膜复合体，使用测微计($7 > 1\mu\text{m}$)制备，商品名“K-402B”型)测定厚度，接着将测定了厚度的位置的陶瓷层完全剥离，在同一位置再次测定厚度，将它们差作为陶瓷片的厚度求出。所述操作是在纵向上以 1m 间隔选取10点，以 1cm 间隔将所述纵向10点的测定沿横向分成10列，全部共实施100点测定，将所得100点的陶瓷片的厚度的平均值作为陶瓷片厚度(单位 ym)。接着，在上述100点的测定中，以大的作为大厚度(单位 μm)、小的作为小厚度(单位 ym)，由下述式求出厚度偏差(单位%)。厚度偏差(%)= $(\text{大厚度}-\text{小厚度})/\text{陶瓷片厚度}\times 100$ 评价按照下述的评价基准实施。[厚度偏差评价基准] 厚度偏差为 2.0% 以下(厚度偏差非常优异，实际应用上完全没有问题的水平)○厚度偏差超过 2.0% 但为 3.0% 以下(厚度偏差优异，实际应用上没有问题的水平)×厚度偏差超过 3.0% (厚度偏差较差，实际应用上有问题的水平)实施例1[聚酯的制备]向100份对苯二甲酸二甲酯和70份乙二醇的混合物中添加作为酯交换催化剂的

乙酸锰4水合物，使所得聚酯中的锰的元素量为 80ppm ，一边将内部温度由 150°C 缓慢升高一边进行酯交换反应。酯交换反应达到 95% 时添加 0.01 份作为稳定剂的亚磷酸，充分搅拌后添加 0.03 份三氧化铋。接着将混入到体系内的水充分馏出，然后添加平均粒径 $0.6\ \mu\text{m}$ 的合成碳酸钙颗粒作为内部填料(滑动剂)，使其相对于所得聚酯的质量为 0.2% (质量)，充分搅拌。接着将反应产物转移到聚合反应器中，在高温真空下(终内部温度为 295°C)进行缩聚，得到特性粘度为 0.65 (35°C ，邻氯苯酚中)的聚对苯二甲酸乙二醇酯组合物。

固形成分重量为 5% (质量)。[未拉伸聚酯薄膜成型步骤]将上述所得聚对苯二甲酸乙二醇酯组合物在 170°C 下干燥5小时，使聚合物的含湿率为 0.05% (质量)。接着将干燥的聚对苯二甲酸乙二醇酯组合物供给挤出机，在熔融温度 280 300°C 下熔融，使用平均网孔 $11\ \mu\text{m}$ 的钢线过滤器进行高精度过滤，然后使用挤出模头、通过静电粘附法与冷却转鼓接触骤冷，获得厚度 $450\ \mu\text{m}$ 的未拉伸聚酯薄膜。[一次拉伸步骤]将所得未拉伸聚酯薄膜在 75°C 下预热，接着在低速、高速辊之间、在薄膜温度 105°C 下沿长度方向拉伸至 3.6 倍，然后骤冷，由此得到长度方向(纵向)拉伸聚酯薄膜。